



001351

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)**

**Федеральное государственное унитарное предприятие
«Уральский научно-исследовательский институт метрологии»
(ФГУП «УНИИМ»)**

Государственный научный метрологический институт

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации методики (метода) измерений**

№ 221.0041/01.00258/2013

Методика измерений толщины нанопокровов методом интерференционной
наименование методики, включая наименование измеряемой величины, и, при необходимости,
оптической микроскопии (оптической профилометрии),
объекта измерений, дополнительных параметров и реализуемый способ измерений

предназначенная для применения в лаборатории ФГАОУ ВПО "УрФУ имени первого
область использования
Президента России Б.Н.Ельцина",

разработанная ИЕН ФГАОУ ВПО "УрФУ имени первого Президента России
наименование и адрес организации (предприятия), разработавшей методику
Б.Н. Ельцина", г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48а

и содержащаяся в документе М.251.13.15.039-2009 Методика измерений толщины
обозначение и наименование документа, содержащего методику, год утверждения, число страниц
нанопокровов методом интерференционной оптической микроскопии (оптической
профилометрии), 2013, на 13 стр.

Методика аттестована в соответствии с ФЗ № 102 "Об обеспечении единства измерений"
и ГОСТ Р 8.563-2009.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по
теоретических и (или) экспериментальных исследований
разработке методики измерений и экспериментальных исследований.

В результате аттестации методики измерений установлено, что методика измерений
нормативно-правовой документ в области обеспечения единства измерений (при наличии) и ГОСТ Р 8.563
соответствует требованиям, предъявляемым ГОСТ Р 8.563-2009.

Показатели точности измерений приведены в приложении на 1 л.

Зам. директора по качеству

Ю.С.Бессонов

Зав. лабораторией

В.В. Казанцев

Дата выдачи

01.08.2013

Рекомендуемый срок пересмотра
методики измерений:

01.08.2018

